



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q79035

Shuichi OHKUBO, et al.

Appln. No.: 10/736,572

Group Art Unit: 2655

Confirmation No.: 4500

Examiner: Unknown

Filed: December 17, 2003

For: OPTICAL DISK, OPTICAL DISK RECORDING/REPRODUCTION APPARATUS,  
AND OPTICAL DISK SIGNAL QUALITY EVALUATION METHOD

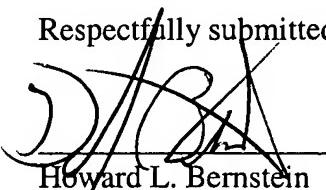
SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are certified copies of the priority documents on which claims to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority documents.

Respectfully submitted,

  
Howard L. Bernstein  
Registration No. 25,665

SUGHRUE MION, PLLC  
Telephone: (202) 293-7060  
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE  
**23373**  
CUSTOMER NUMBER

Enclosures: Japan 2002-365772  
Japan 2003-386726

Date: June 24, 2004

US

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日      2002年12月17日  
Date of Application:

出願番号      特願2002-365772  
Application Number:

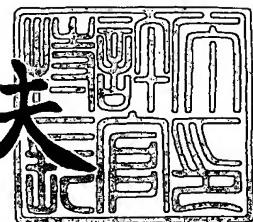
[ST. 10/C] : [JP2002-365772]

出願人      日本電気株式会社  
Applicant(s):  
株式会社東芝

2003年12月3日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願  
【整理番号】 34403232  
【提出日】 平成14年12月17日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G11B 7/00  
**【発明者】**  
【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内  
【氏名】 大久保 修一  
**【発明者】**  
【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内  
【氏名】 本間 博巳  
**【発明者】**  
【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内  
【氏名】 小川 雅嗣  
**【発明者】**  
【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内  
【氏名】 中野 正規  
**【発明者】**  
【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内  
【氏名】 岩永 敏明  
**【発明者】**  
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝横浜事業所内  
【氏名】 柏原 裕  
**【発明者】**  
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝横浜事業所内  
【氏名】 長井 裕士

**【特許出願人】****【識別番号】** 000004237**【氏名又は名称】** 日本電気株式会社**【特許出願人】****【識別番号】** 000003078**【氏名又は名称】** 株式会社 東芝**【代理人】****【識別番号】** 100071272**【弁理士】****【氏名又は名称】** 後藤 洋介**【選任した代理人】****【識別番号】** 100077838**【弁理士】****【氏名又は名称】** 池田 憲保**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 012416**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 0018587**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ディスク及び光ディスク記録再生装置および光ディスクの信号品質評価方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光ディスク媒体に予めエンボス形成により記録、もしくは光学的情報記録装置により記録された信号の品質評価方法において、所定のデータ列及び所定のパーシャルレスポンス特性から求められる目標信号と、クロック周期毎の再生信号との差異である等化誤差をクロック周期毎に算出し、異なる時刻の等化誤差の積に基づいて信号品質を評価することを特徴とする光ディスクの信号品質評価方法。

【請求項 2】 光ディスク媒体に予めエンボス形成により記録、もしくは光学的情報記録装置により記録された信号の品質評価方法において、ある二組の時系列データの差分とパーシャルレスポンス特性とを用いて定義されるノイズベクトル上に等化誤差を射影し、射影された等化誤差の分散と、前記二組の時系列データの差分とパーシャルレスポンス特性とを用いて定義されるユークリッド距離との比に基づいて信号品質を評価することを特徴とする光ディスクの信号品質評価方法。

【請求項 3】 光ディスク媒体に予めエンボス形成により記録、もしくは光学的情報記録装置により記録された信号の品質評価方法において、クロック周期毎の再生信号の値 $y_k$ 、所定のデータ列 $a_k$ 、所定のパーシャルレスポンス特性 $h_k$ に対して、等化誤差を $v_k = (y_k - \sum a_{k-i} h_i)$ 、クロック時間を単位とする時間遅延演算子を $D$ 、 $1, 0, -1$ の3種類のいずれかの値を取り、かつ、 $\alpha_j \alpha_{j+1} \neq -1$ を満足する係数を $\alpha_j$ として定義される多項式を $A(D) = \sum \alpha_j D^j$ 、パーシャルレスポンスを規定するPR多項式を $H(D) = \sum h_k D^k$ とし、 $N(D) = A(D)H(D) = \sum \epsilon_i D^i$ で定義される多項式に基づいて、下記式で定義される値を算出し、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする光ディスクの信号品質評価方法。

## 【数1】

$$S = \frac{N(\sum_i \varepsilon_i^2)^2}{\sum_{k=1}^N (\sum_i \varepsilon_i v_{k+i})^2}$$

【請求項4】 前記 $\varepsilon_i$ の組み合わせのうち、 $d = \sum \varepsilon_i^2$ を最小とする $\varepsilon$ の組み合わせ及び2番目に小さいdを与える $\varepsilon$ の組み合わせの少なくとも2つに対して得られる前記Sの値に基づいて、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする請求項3に記載の光ディスクの信号品質評価方法。

【請求項5】 パーシャルレスポンスとして、 $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 2, h_3 = 2, h_4 = 1$ を用い、前記dが12及び14となる前記 $\varepsilon$ の組み合わせそれぞれに対して得られる前記Sの値に基づいて、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする請求項3に記載の光ディスクの信号品質評価方法。

【請求項6】 パーシャルレスポンスとして、 $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 2, h_3 = 2, h_4 = 1$ を用い、前記 $\varepsilon$ の組み合わせのうち、下記の少なくとも3つの組み合わせそれぞれに対して得られる前記Sの値に基づいて、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする請求項3に記載の光ディスクの信号品質評価方法。

## 【数2】

$$\varepsilon: \varepsilon_0 = 1, \varepsilon_1 = 2, \varepsilon_2 = 2, \varepsilon_3 = 2, \varepsilon_4 = 1$$

$$\varepsilon: \varepsilon_0 = 1, \varepsilon_1 = 2, \varepsilon_2 = 1, \varepsilon_3 = 0, \varepsilon_4 = -1, \varepsilon_5 = -2, \varepsilon_6 = -1$$

$$\varepsilon: \varepsilon_0 = 1, \varepsilon_1 = 2, \varepsilon_2 = 1, \varepsilon_3 = 0, \varepsilon_4 = 0, \varepsilon_5 = 0, \varepsilon_6 = 1, \varepsilon_7 = 2, \varepsilon_8 = 1$$

【請求項7】 パーシャルレスポンスとして、 $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 2, h_3 = 2, h_4 = 1$ を用い、請求項2に記載の等化誤差 $v_k$ 及びサンプル数Nに対して $R_i = \sum v_k v_{k+i} / N$ とし、下式で表されるS1、S2、S3の値を調べて光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする請求項1に記載の光ディスクの信号品質評価方法。

## 【数3】

$$S1 = \frac{14}{R_0 + (12R_1 + 8R_2 + 4R_3 + R_4) / 7}$$

## 【数4】

$$S2 = \frac{12}{R_0 + (8R_1 + R_2 - 4R_3 - 6R_4 - 4R_5 - R_6)/6}$$

## 【数5】

$$S3 = \frac{12}{R_0 + (8R_1 + 2R_2 + R_4 + 4R_5 + 6R_6 + 4R_7 + R_8)/6}$$

【請求項8】 前記所定のデータ列がビタビ復号器により2値化したデータであることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の光ディスクの信号品質評価方法。

【請求項9】 前記サンプル数Nが $10^4$ 個以上であることを特徴とする請求項3乃至請求項8のいずれか1項に記載の光ディスクの信号品質評価方法。

【請求項10】 請求項3に記載のSの値あるいは請求項7に記載のS1, S2, S3の値が12以上となる条件でデータが記録されていることを特徴とする光ディスク。

【請求項11】 請求項3に記載のSの値あるいは請求項7に記載のS1, S2, S3の値が12以上となる条件で、記録もしくは再生を行うことを特徴とする光ディスクの記録再生あるいは再生装置。

【請求項12】 クロック周期毎の再生信号の値及び所定のデータ列及び所定のパーシャルレスポンス特性から求められる目標信号を生成する機能と、クロック周期毎の再生信号と目標信号との差異である等化誤差を算出する機能とを光ディスクの記録再生あるいは再生装置。

【請求項13】 異なる時刻における前記等化誤差の和あるいは積あるいは積和演算を行う機能を有する請求項12に記載の光ディスクの記録再生あるいは再生装置。

【請求項14】 前記等化誤差を少なくとも $10^4$ 個以上算出することを特徴とする請求項12あるいは請求項13に記載の光ディスクの記録再生あるいは再生装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

### 【発明の属する技術分野】

本発明は、光学情報の信号品質評価方法及び光学情報の記録再生装置及び光ディスクに関する。

### 【0002】

#### 【従来の技術】

光ディスクは、予めデータが記録された再生専用の光ディスクと情報の記録が可能な光ディスクの2種類に分類される。再生専用の光ディスクでは、通常マスタリングプロセスと呼ばれる露光プロセスを利用して光ディスク上にエンボス（物理的な凹凸）を形成することでデータが記録される。記録が可能な光ディスクでは、光ディスクに集光されたレーザ光を照射して、記録膜の何らかの物理的な特性を変化させることで記録が行われる。

### 【0003】

従来、光ディスクに記録されたこれらの信号の品質評価は、光ディスクにレーザを照射して得られる再生信号のジッタ特性（光ディスク技術：ラジオ技術社p.212-p.220などに詳述）を測定して行われるのが一般的であった。ジッタ特性は通常、図3に示すように、再生信号のある基準電位でスライスして得られるエッジ位置の時間的な揺らぎとして表現される。

### 【0004】

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図3から分かるように、記録密度が高くなるとマーク長が短い場合には信号振幅が低下し、エッジ位置検出のためのスライスレベルを横切らなくなってしまうため、ジッタ測定が困難となる。更に、記録容量向上のために記録密度を高くすると、図3に示すように、符号間干渉の影響が大きくなり信号振幅が低下して、エッジ位置検出のためのスライスレベルを横切らなくなってしまい、その結果、ジッタ測定が困難となる。

### 【0005】

符号間干渉を低減するように、等化器を用いて再生波形をフィルタリングする手法が従来用いられていた。しかしながら、通常等化器は符号間干渉を抑制する一方で、ノイズ成分を高めてしまうため、記録密度が非常に高くなった場合には

、再生信号から記録された元データを復号することが困難となってしまう。

#### 【0006】

記録密度が非常に高い場合に、精度良くデータを復号する手法として、PRML (Partial-Response Maximum-Likelihood) と呼ばれる信号検出方法が知られている。この手法では、ノイズ成分を高めないように、再生波形を符号間干渉を有する波形に等化 (PR等化) し、ビタビ復号 (ML) と呼ばれる手法でデータを識別する。PR等化は、データ周期 (クロック) 每の振幅で規定され、例えば、PR(abc) は、時刻0での振幅がa、時刻Tでの振幅がb、時刻2Tでの振幅がc、それ以外の時刻での振幅は0となる。振幅が0でない成分の総数は拘束長と呼ばれる。

#### 【0007】

PRMLでは、エッジ位置を検出してデータを復号するのではなく、再生波形をクロック周期毎にサンプリングして得られた値を用いて、ビタビ復号によりデータを復号するため、エッジ位置の時間的な揺らぎ情報だけでは、PRMLの検出性能を推測することは困難である。

#### 【0008】

そこで、本発明は、記録密度が高く、ジッタ測定が困難な場合に、ジッタに変わる信号品質評価指標及びその基準値を提供することを目的とする。

#### 【0009】

##### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明は、光ディスク媒体に予めエンボス形成により記録、もしくは光学的情報記録装置により記録された信号の品質評価方法において、所定のデータ列及び所定のパーシャルレスポンス特性から求められる目標信号と、クロック周期毎の再生信号との差異である等化誤差をクロック周期毎に算出し、異なる時刻の等化誤差の積に基づいて信号品質を評価することを特徴とする。

#### 【0010】

また、ある二組の時系列データの差分とパーシャルレスポンス特性とを用いて定義されるノイズベクトル上に等化誤差を射影し、射影された等化誤差の分散と、前記二組の時系列データの差分とパーシャルレスポンス特性とを用いて定義さ

れるユークリッド距離との比に基づいて信号品質を評価することを特徴とする。

#### 【0011】

また、信号の品質評価方法において、クロック周期毎の再生信号の値 $y_k$ 、所定のデータ列 $a_k$ 、所定のパーシャルレスポンス特性 $h_k$ に対して、等化誤差を $v_k = (y_k - \sum a_{k-i} h_i)$ 、クロック時間を単位とする時間遅延演算子をD、1, 0, -1の3種類のいずれかの値を取り、かつ、 $\alpha_j - \alpha_{j+1} \neq -1$ を満足する係数を $\alpha_j$ として定義される多項式を $A(D) = \sum \alpha_j D^j$ 、パーシャルレスポンスを規定するPR多項式を $H(D) = \sum h_k D^k$ とし、 $N(D) = A(D)H(D) = \sum \epsilon_i D^i$ で定義される多項式に基づいて、下記式

#### 【数6】

$$S = \frac{N(\sum_i \epsilon_i^2)^2}{\sum_{k=1}^N (\sum_i \epsilon_i v_{k+i})^2}$$

で定義される値を算出し、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする。

#### 【0012】

さらに、前記 $\epsilon_i$ の組み合わせのうち、 $d = \sum \epsilon_i^2$ を最小とする $\epsilon$ の組み合わせ及び2番目に小さいdを与える $\epsilon$ の組み合わせの少なくとも2つに対して得られる前記Sの値に基づいて、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする。

#### 【0013】

さらに、パーシャルレスポンスとして、 $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 2, h_3 = 2, h_4 = 1$ を用い、前記dが12及び14となる前記 $\epsilon$ の組み合わせそれぞれに対して得られる前記Sの値に基づいて、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする。

#### 【0014】

また、パーシャルレスポンスとして、 $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 2, h_3 = 2, h_4 = 1$ を用い、前記 $\epsilon$ の組み合わせのうち、下記の少なくとも3つの組み合わせそれぞれに対して得られる前記Sの値に基づいて、光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする。

## 【0015】

$\epsilon : \epsilon_0 = 1, \epsilon_1 = 2, \epsilon_2 = 2, \epsilon_3 = 2, \epsilon_4 = 1$

$\epsilon : \epsilon_0 = 1, \epsilon_1 = 2, \epsilon_2 = 1, \epsilon_3 = 0, \epsilon_4 = -1, \epsilon_5 = -2, \epsilon_6 = -1$

$\epsilon : \epsilon_0 = 1, \epsilon_1 = 2, \epsilon_2 = 1, \epsilon_3 = 0, \epsilon_4 = 0, \epsilon_5 = 0, \epsilon_6 = 1, \epsilon_7 = 2, \epsilon_8 = 1$

## 【0016】

また、パーシャルレスポンスとして、 $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 2, h_3 = 2, h_4 = 1$ を用い、請求項2に記載の等化誤差 $v_k$ 及びサンプル数Nに対して $R_i = \sum v_k v_{k+i} / N$ とし、下式で表されるS1、S2、S3の値を調べて光ディスクに記録された信号の品質を評価することを特徴とする。

## 【0017】

## 【数7】

$$S1 = \frac{14}{R_0 + (12R_1 + 8R_2 + 4R_3 + R_4)/7}$$

## 【数8】

$$S2 = \frac{12}{R_0 + (8R_1 + R_2 - 4R_3 - 6R_4 - 4R_5 - R_6)/6}$$

## 【数9】

$$S3 = \frac{12}{R_0 + (8R_1 + 2R_2 + R_4 + 4R_5 + 6R_6 + 4R_7 + R_8)/6}$$

## 【0018】

また、本発明は、等化誤差を算出するための目標信号を生成するためのデータ列として、ビタビ復号器により2値化したデータを用いることを特徴とし、また、 $10^4$ 個以上の等化誤差を使用して信号品質を評価することを特徴とする。

## 【0019】

また、本発明にかかる光ディスクは、前記Sの値あるいは前記S1、S2、S3の値が1以上となる条件でデータが記録されていることを特徴とする。

## 【0020】

また、本発明にかかる光ディスクの記録再生あるいは再生装置は、前記Sの値

あるいは前記S1, S2, S3の値が12以上となる条件で、記録もしくは再生を行うことを特徴とする。

#### 【0021】

さらに、本発明にかかる光ディスクの記録再生あるいは再生装置は、クロック周期毎の再生信号の値及び所定のデータ列及び所定のパーシャルレスポンス特性から求められる目標信号を生成する機能と、クロック周期毎の再生信号と目標信号との差異である等化誤差を算出する機能とを有することを特徴とする。

#### 【0022】

また、本発明にかかる光ディスクの記録再生あるいは再生装置は、異なる時刻における前記等化誤差の和あるいは積あるいは積和演算を行う機能を有することを特徴とし、また、前記等化誤差を少なくとも $10^4$ 個以上算出することを特徴とする。

#### 【0023】

PRMLではビタビ復号と呼ばれるアルゴリズムに基づいてデータの判別が行われる。ビタビ復号では、クロック周期毎に、再生信号の値とパーシャルレスポンスで定められる所定のレベルとの差の自乗を算出し、各パスに沿ってその自乗和を算出し、自乗和が最小となるパスを選択することによりデータの復号が行われる。

#### 【0024】

ビタビ復号で検出誤りが起きやすいのは、パス間のユークリッド距離が小さい場合である。異なるパス間のユークリッド距離dは、一方のパスに沿ったデータ列 $b_k$ で定められる多項式を $B(D) = \sum b_k D^k$ 、他方のパスに沿ったデータ列 $c_k$  ( $b_k, c_k$  は1もしくは-1の2値データ) で定められる多項式を $C(D) = \sum c_k D^k$ 、パーシャルレスポンスを規定する多項式 $H(D) = \sum h_k D^k$ として、 $N(D) = (B(D) - C(D))H(D) = 2 \sum \epsilon_i D^i$  として、 $d^2 = 4 \sum \epsilon_i^2$ で定義される。ここで、Dはクロック時間を単位とする時間遅延演算子を表し、 $h_k$ は所定のパーシャルレスポンス特性を表す。パーシャルレスポンス特性は、一般に0でない $h_k$ の成分を使用して $PR(h_0, h_1, h_2, h_3, \dots)$ と記述される。

#### 【0025】

パーシャルレスポンスを  $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 1, h_3$  以降はすべて0（この場合PR(1, 2, 1)と表現される）とし、データ列  $b_k$  を  $b_0 = 1, b_1 = 1, b_2 = -1, b_3$  以降はすべて-1、また、データ列  $c_k$  を  $c_0 = -1, c_1 = 1, c_2 = 1, c_3$  以降はすべて-1とすると、データ列  $b_k$  に沿ったパスとデータ列  $c_k$  に沿ったパス間のユークリッド距離は、 $N(D) = 2(1-D^2)(1+2D+D^2) = 2*(1+2D-2D^3-D^4)$  から  $d^2 = 4*(1*1+2*2+2*2+1*1)$  と求められる（2値データを表現するのに1/0の組み合わせを用いる場合と、1/-1の組み合わせを用いる場合があるが、本明細書では1/-1の組み合わせを用いている。）。

### 【0026】

PR多項式が規定されれば、各々の  $\epsilon_i$  の組み合わせについてパス間のユークリッド距離を算出することができる。なお、光ディスクでは一般に  $d \geq 1$  のラン長制限の記録符号が用いられ、例えば、 $d=1$  の記録符号の場合、ディスク上には2T以上の長さのマークが記録される。この制限をユークリッド距離算出において考慮するには、 $\epsilon_i$  の組み合わせについて  $\epsilon_i \epsilon_{i+1} \neq -1$  という制約を課せば良い。すなわち、 $\epsilon_i \epsilon_{i+1} = -1$  を満たすデータ列は例えば、データ列  $b_k$  として、 $(x, 1, -1, y)$ 、データ列  $c_k$  として、 $(x, -1, 1, y)$  が考えられるが、 $d=1$  の制限下では、 $(1, -1, 1)$  もしくは  $(-1, 1, -1)$  というパターンは禁じられているので、 $x=-1$  もしくは  $y=1$  の場合にはデータ列  $b_k$  がラン長制限を破るパターン（存在し得ないパターン）となり、また、 $x=1$  もしくは  $y=-1$  の場合にはデータ列  $c_k$  がラン長制限を破るパターンとなるため、ラン長制限を満たしつつ、 $\epsilon_i \epsilon_{i+1} = -1$  を満足するデータ列  $b_k, c_k$  の組み合わせは存在しないこととなる。また、ディスク上に記録されるマークの長さが3T以上の場合には  $\epsilon_i \epsilon_{i+1} \neq -1$ 、かつ、 $\epsilon_i \epsilon_{i+2} \neq -1$  の制約を課せば良い。

### 【0027】

ユークリッド距離が  $d$  の2つのパス間で検出誤りが起こる確率は、例えば、データ列  $b_k$  を基準に考えると、ノイズの影響により  $\sum (y_k - \sum b_{k-i} h_i)^2$  が  $\sum (y_k - \sum c_{k-i} h_i)^2$  より大きくなる確率と等価である。データ列  $b_k$  を基準に考えた場合、 $y_k - \sum b_{k-i} h_i$  は等化誤差であり、また、 $\sum (y_k - \sum b_{k-i} h_i)^2$  と  $\sum (y_k - \sum c_{k-i} h_i)^2$  の大小関係は、 $B(D)H(D)$  と  $C(D)H(D)$  の差で定義される多項式の係数をベクトルの成分と

見なしてエラーベクトルを定義し、そのエラーベクトル上に等化誤差を射影しても良く、この場合、検出誤りが起こる確率は、エラーベクトル上に射影されたノイズの大きさ（ノイズの分散）が、パス間のユークリッド距離の半分より大きくなる確率で定義されることになる。従って、パス間のユークリッド距離とエラーベクトル上に射影されたノイズの分散の比を算出すれば、信号品質を推定することが可能となる。なお、基準となるデータ列は、記録条件の調整時など事前にデータが分かっている場合にはそのデータ列を、また、データが分からない場合には、確からしいデータである、ビタビ復号器により2値化されたデータを用いれば良い。

### 【0028】

データ列 $b_k$ を $b_0 = -1, b_1 = 1, b_2$ 以降すべて1、また、データ列 $c_k$ を $c_0 = 1, c_1$ 以降もすべて1とすると、 $A(D) = C(D) - B(D) = 2 \sum \alpha_j D^j$ において、 $\alpha_0 = 1, \alpha_1$ 以降はすべて0となる。例えば、 $H(D)$ として、 $h_0 = 1, h_1 = 2, h_2 = 2, h_3 = 1$ を用いる場合（PR(1, 2, 2, 1)に相当）、エラーベクトルを規定する多項式 $N(D) = A(D)H(D) = 2 \sum \epsilon_i D^i$ の係数 $\epsilon_i$ は $\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ の順に(1, 2, 2, 1)となる。したがって、PR(1221)に対して、上記データ列 $b_k$ を上記データ列 $c_k$ と誤る確率は、 $2^*(1, 2, 2, 1)$ 上に射影された等化誤差の大きさが2つのパス間のユークリッド距離（この場合は、 $2^*(1+2*2+2*2+1)^{1/2}$ ）の半分より大きくなる確率となる。等化誤差のエラーベクトル上への射影は、下記式

### 【数10】

$$\frac{2 \sum_i \epsilon_i v_{k+i}}{\sqrt{2 \sum_i \epsilon_i^2}}$$

で表されるので、エラーベクトル上に射影されたノイズの分散CNは下記式

### 【数11】

$$CN = \frac{\sum_{k=1}^N (\sum_i \epsilon_i v_{k+i})^2}{N \sum_i \epsilon_i^2}$$

で表されることとなる。信号振幅に相当する2つのパス間のユークリッド距離の半分は下記式

## 【数12】

$$\sqrt{\sum_i \varepsilon_i^2}$$

であり、電力に相当するその振幅の自乗Eは下記式

## 【数13】

$$E = \sum_i \varepsilon_i^2$$

であるので、E/CNが誤り確率と相関を有する指標として求められる (A(D)及びN(D)の全体にかかる係数2は、計算結果に影響を与えない)ので、係数2を省略して、  
 $A(D) = \sum \alpha_j D^j$ 、 $N(D) = \sum \varepsilon_i D^i$ として式を算出しても結果は同一である。)。

## 【0029】

以上説明したように、クロック周期毎の再生信号の値 $y_k$ 、目標信号生成のための所定のデータ列 $a_k$ 、所定のパーシャルレスポンス特性 $h_k$ に対して、等化誤差を $v_k = (y_k - \sum a_{k-i} h_i)$ 、クロック時間を単位とする時間遅延演算子をD、1, 0, -1の3種類のいずれかの値を取り、かつ、 $\alpha_j \alpha_{j+1} \neq -1$ を満足する係数を $\alpha_j$ として定義される多項式を $A(D) = \sum \alpha_j D^j$ 、パーシャルレスポンスを規定するPR多項式を $H(D) = \sum h_k D^k$ とし、 $N(D) = A(D)H(D) = \sum \varepsilon_i D^i$ で定義される多項式に基づいて、下記式

## 【数14】

$$S = \frac{N(\sum_i \varepsilon_i^2)^2}{\sum_{k=1}^N (\sum_i \varepsilon_i v_{k+i})^2}$$

で定義される信号品質評価値を算出すれば、検出誤りを起こす確率、すなわち再生信号の信号品質を評価することが可能となる。

## 【0030】

誤りやすいデータ列の組み合わせの1例として、上記では、 $b_k$ と $c_k$ を引用して説明を行ったが、エラーベクトル上に射影されたノイズの分散を算出する際、必ずしも、データ列 $b_k$ のみを選択して等化誤差を算出する必要はなく、すなわち、目標信号生成のためのデータ列 $a_k$ の中からデータ列 $b_k$ に相当する時刻を抽出して

等化誤差の分散を算出する必要はなく、毎クロック時刻毎に算出された等化誤差を用いて分散を算出しても良い。これは、等化誤差がガウス分布に従って確率的に分布しているのであれば、特定部分を抽出して分散を算出しても、全体を用いて分散を算出しても結果は変わらないからである。もちろんある特定のデータ列  $b_k$  にのみ着目してノイズの分散を計算しても良いが、パターンを選別せずに等化誤差の分散を算出する方が回路の構成がより簡略になるという利点がある。

### 【0031】

#### 【発明の実施の形態】

図1は前述の信号品質評価値Sを算出するための機能ブロックの1例を表している。再生波形をAD変換器10により一定周波数でサンプリングした後、PLL（位相同期ループ）回路を含んだ等化器11によりクロック周期毎の等化再生波形データが得られる。等化は、ノイズ成分をできるだけ抑制しつつ、再生波形がPR波形に基づく目標波形にできるだけ近づくように等化される。信号品質評価器12は、入力した等化再生波形を用いて信号品質評価値Sを算出して、再生波形の品質評価を行う。なお、再生専用の光ディスクの場合や他の記録装置で記録された記録可能な光ディスクの場合、ディスクに記録された元データ  $a_k$  は常に予め知られているとは限らない。この場合は、信号品質評価器12に含まれる識別器（ビタビ復号）により2値化されたデータを  $a_k$  として代用すれば良い。

### 【0032】

図1に示した信号品質評価12の1例を詳細に示したのが図2である。基準のPR波形を  $h_i$ 、識別器20（ビタビ復号器が代表的）により2値化データを  $a_k$  とすると、目標信号生成器21により目標信号  $R_k$  が下記式

#### 【数15】

$$R_k = \sum_i a_{k-i} \times h_i$$

に基づいて生成され、等化されたクロック周期毎の再生信号  $y_k$  と  $R_k$  の差である等化誤差  $v_k$  が比較演算器22により求められる。等化誤差をエラーベクトル上に射影するため、タップ23によりクロック周期毎に等化誤差を遅延させ、タップ係数  $\epsilon_i$  を介して足し合わせる構成となっている。 $\epsilon_i$  は、前述したN(D)の係数である。 $\epsilon_i$  の組み合わせを  $j$  で区別し、それに対応するSの値を  $S_j$  と定義すると、

図2に示したタップ12(D)の総数mはjによって変化することになる。例えば、仮にj=1に対応する  $\epsilon_i$  の組み合わせを  $\epsilon_0=1, \epsilon_1=1, \epsilon_2=0, \epsilon_3=0, \epsilon_4=1, \epsilon_5$  以降はすべて0とし、j=2に対応する  $\epsilon_i$  の組み合わせを  $\epsilon_0=1, \epsilon_1=2, \epsilon_2=1, \epsilon_3$  以降はすべて0とすると、S<sub>1</sub>を算出する場合はm=4、S<sub>2</sub>を算出する場合はm=2となる。組み合わせjに応じてタップ数を変化させるのが煩雑な場合は、タップ数を十分に多く（例えば15～20程度）確保しておき、計算に必要なタップ係数を0に設定しておけば良い。

### 【0033】

タップ係数を介して足し合わされた等化誤差を乗算器24で自乗し、等化誤差のサンプル総数Nについて和算器25により足し合わせることで、エラーベクトル上に射影されたノイズの分散に比例する（N及び $\sum \epsilon_i^2$ で割ると分散になるが、N及び $\sum \epsilon_i^2$ は定数であるので乗算器25の係数として用いられている）値が求められる。除算器25によりこの値の逆数を取り、乗算器25で $(N \sum \epsilon_i^2) * \sum \epsilon_i^2$ との積を取ることでSが求められる。なお、再生波形のサンプル総数は正確にはN+m必要であるが、Nは10<sup>4</sup>以上（必要なサンプル総数については後述する）であるのに対し、mはたかだか20程度であるので、本明細書中ではサンプル数をNとして統一して表現している。

### 【0034】

#### （実施例1）

厚さ0.6 mmのポリカーボネート基板に予めエンボス記録されたピットデータ列を有する再生専用の光ディスクを用いて、ピットエラーレート（bER）とSの関係を調べた。

### 【0035】

本実施例において基板に形成されたピット列は、（1-7）変調方式に基づいて変調されたランダムデータにより記録されており、最短ピットである2Tピットの長さは0.2 μm、ピットの半径方向の間隔は0.4 μmであった。このROMディスクを波長405 nm、対物レンズの開口数（NA）0.65の光ヘッドを用いて、線速6.6 m/s、再生パワー0.5 mWの条件で再生し（この場合、クロック周期Tは15.15 nsとなる）、再生波形をPR(12221)に等化して、bER及びSの測定を行った。bERは光デ

イスクに記録された元データとビタビ復号により2値化されたデータとを比較することにより行った。Sは、PR等化後の再生波形のT毎の値を10<sup>5</sup>個と、ビタビ復号により2値化されたデータとを用いて算出した。

### 【0036】

(1-7)変調はd>=1制限の符号であり、PR(12221)に対しては、表1に上げた $\epsilon_i$ に対してユークリッド距離が小さくなる。表1のパターン1で識別した $\epsilon_i$ の組み合わせ(1 2 2 2 1)は、ビタビ検出で誤りやすい2組のデータ列例えば、bk:(1 1 1 1 -1 -1...)とck: (-1 1 1 1 -1 -1...)と、パーシャルレスポンス特性(1 2 2 2 1)から定められるエラーベクトルである。なお、表1に示したパターン2以降の $\epsilon_i$ の組み合わせに対しては、2Tのマーク／スペースが連続する回数の上限（データ列として+1 +1 -1 -1 が連続する回数の上限:-1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 のような場合には1回、-1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 のような場合には2回と数える）によって、(1, 2, 1)と(-1, -2, -1)の間の0の数及び(1, 2, 1)と(1, 2, 1)の間にに入る0の上限が決まる。すなわち、2Tのマーク／スペースが連続する回数の上限が2n+1回の場合、(1, 2, 1)と(-1, -2, -1)の間には最大4n+1個の0が入り、連続する回数の上限が2n+2回の場合には、(1, 2, 1)と(1, 2, 1)の間には最大4n+3個の0が入ることになるので、その上限までのパターンを考慮してSを算出すれば良い。表1には、2Tの連続が最大5までの場合の $\epsilon_i$ の例を示しており、本実施例で用いた光学情報記録媒体上にエンボス記録されたパターンにおいても、2Tの連続は最大5までとした。

### 【0037】

なお、表1に示したパターンと極性が反対のパターン（例えばパターン1に対しては、(-1 -2 -2 -2 -1)）も考えられるが、求められるSの値は同一であるので、決まった極性（もしくはどちらの極性でもかまわないが、両方を評価する必要はない）のパターンのみ考慮しておけば良い。本実施例ではタップ総数を14個（S<sub>6</sub>の算出に必要なタップ数に相当）に固定しておき、例えば、パターン1に対応するS<sub>1</sub>の値を算出する際には5番目以降のタップ係数はすべて0として算出を行った。

### 【0038】

【表1】

 $\varepsilon_i$  の組み合せ例

パターンj	$\varepsilon_i$	$\sum \varepsilon_i^2$
1	1 2 2 2 1	14
2	1 2 1 0 -1 -2 -1	12
3	1 2 1 0 0 0 1 2 1	12
4	1 2 1 0 0 0 0 0 -1 -2 -1	12
5	1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1	12
6	1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1	12

## 【0039】

表2にチルトを変えながら測定したSの値を示す。S<sub>j</sub>は表1のパターンjに対して求めたSの値を表している。

## 【0040】

【表2】

チルトとSの関係

チルト(度)	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>
-0.3	14	14.5	14.4	14.7	14.7	15
-0.2	15	15.4	15.4	15.9	15.9	16.2
0.1	16.5	17.5	17.6	18	17.9	18.3
0	17	18	18.1	18.5	18.5	18.8
0.1	16.7	17.1	17.1	17.5	17.6	17.8
0.2	14.8	15.3	15.3	15.8	15.7	16
0.3	13.8	14.2	14.1	14.6	14.6	14.9

## 【0041】

表2にまとめたように、本実施例ではいずれの条件でもパターン1に対するSの値S<sub>1</sub>が最も小さかった。各チルト条件におけるSの最小値とbERの関係を図4に示す。Sの値とbERには明確な相関があることが分かる。

## 【0042】

本実施例では予め光ディスクに記録されている元データを用いてbERを測定することができたが、通常、再生専用ディスクに記録されている正確な元データを知ることは困難であるため、bERそのものを測定することはほとんどできない。そのため、bERを指標として再生条件の調整を行うことは非常に困難である。しかしながら、そのような場合であっても、本実施例で説明したように、Sの値を指標として再生条件を調整することにより、光ディスクに記録された情報を安定に再生することが可能である。

### 【0043】

表2から分かるように、いずれのチルトでもS4あるいはS6はS2より大きく、また、S5もS3より大きいので、 $\sum \epsilon_i^2=12$ に対するパターンとして、表1のパターン2及びパターン3のみを考慮して、より簡略にSの評価を行うことも可能である。

### 【0044】

なお、 $\sum \epsilon_i^2=3$ 番目に小さいパターンとして、 $\sum \epsilon_i^2=16$ となる $\epsilon_i$ のパターンの例として(1 2 1 0 -1 -1 1 1 0 -1 -2 -1)、(1 2 1 0 0 0 1 1 -1 -1 0 1 2 1)などがあるが、表2には記述していないが、これらのパターンに対して得られるSの値は、 $\sum \epsilon_i^2=12$ あるいは14となるパターンに対して得られるSの値より小さくなることはなかったので、 $\sum \epsilon_i^2=16$ となるパターンに対してSの値を評価しておく必要は必ずしも無い。

### 【0045】

#### (実施例2)

厚さ0.6 mmのポリカーボネート基板上に形成された相変化光ディスクを用いて、bERとSの関係を調べた。基板の案内溝のピッチは0.68 μmとした。相変化光ディスクを線速5.6 m/sで回転させながら、波長405nm、NA=0.65の光ヘッドを用いて、クロック周波数64.6 MHz（クロック周期15.48 ns）で（1-7）変調により変調されたランダムデータを記録再生して評価を行った。PR等化は実施例1と同様にPR(12221)とした。記録パワを6 mW、消去パワを2.5 mWとし、ランダムデータを10回オーバライトした後、フォーカスオフセット量を変化させながらSとbERを測定した。実施例1と同様に2Tの連続は最大5までとして記録を行って、PR等化後の再生波形のクロック毎の値を10<sup>5</sup>個と、ビタビ復号により2値化されたデータとを用いてS<sub>1</sub>～S<sub>6</sub>の値を算出した。

### 【0046】

【表3】

デフォーカスとSの関係

デフォーカス (μm)	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>
-0.3	12	11.5	11.8	118	12	12
-0.2	15	14.4	14	14.7	14.3	15.1
0.1	17	16.4	16.1	16.8	16.5	17
0	18	17.5	17	18	17.4	18.3
0.1	16.9	16.3	16	16.9	16.3	17.2
0.2	14.8	14.5	13.8	15	15	15.4
0.3	11.8	11.5	12	11.9	11.9	12.2

## 【0047】

表3にまとめたように、本実施例では、いずれの条件でもパタン2あるいはパタン3に対するSの値が最も小さかった。各デフォーカス条件におけるSの最小値とbERの関係を図5に示す。図4と同様にSの値とbERには明確な相関があり、また、その相関も図3の場合と同様であることが分かる。また、Sの最小値が12以上であれば、bERは3e-4以下となることが確認できた。bER3e-4はリードソロモン等のECC（誤り訂正符号）を用いて実用上問題ないレベルに誤り訂正が可能な目安となる値である。従って、Sの最小値が12以上となるように、再生条件（チルトやデフォーカス）を調整すれば、光ディスクの再生装置を安定に動作させることができるとなる。

## 【0048】

なお、表3から分かるように、いずれのデフォーカス条件でもS4あるいはS6はS2より大きく、また、S5もS3より大きいので、Σε<sub>i</sub><sup>2</sup>=12に対するパタンとして、表1のパタン2及びパタン3のみを考慮して、より簡略にSの評価を行うことも可能である。

## 【0049】

以上説明したように、Sの値に基づいて記録再生条件を調整することが可能であるが、実施例1及び実施例2に示したように、Sが最小となるのは、S1、S2、S3のいずれかであるので、この3つのSの値を調べれば、より簡略に記録再生条件を調整することができる。

## 【0050】

Sの値に基づいて記録条件あるいは再生条件を調整する機能を有する光学情報

記録再生装置の例を図9に示す。光ヘッドから読み出された再生信号の品質を信号品質評価器により算出されたSの値に基づいて判断する。記録／再生条件調整器（例えば、チルトやデフォーカスあるいは記録パワなど）により記録／再生条件を変化させながら、各条件毎にSを算出し、Sが最大となる条件、もしくは、Sが一定の値（例えば上記したように12以上）となる記録／再生条件を見つけることで、情報の記録／再生を安定した条件で行うことができる。

### 【0051】

（実施例3）

Sの値を算出する別の実施の形態について説明する。

### 【0052】

$\sum (v_k + 2v_{k+1} + 2v_{k+2} + 2v_{k+3} + v_{k+4})^2 = N * (14R_0 + 24R_1 + 16R_2 + 8R_3 + 2R_4)$ 、 ( $R_i = \sum v_k v_{k+i}$  / Nと定義) であることを利用すると、実施例1あるいは実施例2におけるS1の値は、下記式

### 【数16】

$$S1 = \frac{14 \times 14}{14R_0 + 24R_1 + 16R_2 + 8R_3 + 2R_4} = \frac{14}{R_0 + (12R_1 + 8R_2 + 4R_3 + R_4)/7}$$

と表現することもできる。同様に、S2、S3も

### 【数17】

$$S2 = \frac{12 \times 12}{12R_0 + 16R_1 + 2R_2 - 8R_3 - 12R_4 - 8R_5 - 2R_6} = \frac{12}{R_0 + (8R_1 + R_2 - 4R_3 - 6R_4 - 4R_5 - R_6)/6}$$

### 【数18】

$$S3 = \frac{12 \times 12}{12R_0 + 16R_1 + 4R_2 + 2R_4 + 8R_5 + 12R_6 + 8R_7 + 2R_8} = \frac{12}{R_0 + (8R_1 + 2R_2 + R_4 + 4R_5 + 6R_6 + 4R_7 + R_8)/6}$$

と表現することができる。R<sub>i</sub>は等化誤差の自己相関に相当し、R<sub>0</sub>以外の値が0であれば、等化誤差は白色であることが分かる。なお、表1に示したS1、S2、S3以外のSの値、あるいは、任意のε<sub>i</sub>の組み合わせに対しても、同様の算出を行うことにより、自己相関の関数としてSを表現することが可能である。

### 【0053】

この表現で表されるSの値を算出するための機能ブロックの構成の1例を示し

たのが図6である。図2の場合と異なり、等化誤差の自己相関を計算し、それらを所定の重み付け（乗算器61により係数 $\beta_i$ を乗算）を行った後和を取る構成となっている。乗算器61の係数 $\beta_i$ は、例えばS1を算出するには、S1の分子を14\*14とした場合は、 $\beta_0=14$ ,  $\beta_1=24$ ,  $\beta_2=16$ ,  $\beta_3=8$ ,  $\beta_4=2$ 、S1の分子を14とした場合は $\beta_0=14/14$ ,  $\beta_1=24/14$ ,  $\beta_2=16/14$ ,  $\beta_3=8/14$ ,  $\beta_4=2/14$ とすれば良い。図6における乗算器61の個数は算出するSjにより変化し、上記のS3を求めるには9個の乗算器が必要となる。この場合もパタンによって乗算器の個数を変化させるのが煩雑な場合は、十分多い（15～20個程度）乗算器を確保しておき、演算に関係ない乗算器の係数を0にしておけば良い。

#### 【0054】

また、図6において平均を取らない（サンプル総数Nで割らない）構成を取ることもでき、その場合は、単に和を取ってSの分子（この例では12あるいは14）にNをかければ良い。

#### 【0055】

図6に示した構成を用いて、実施例1及び実施例2と同様の測定を行ったところ、実施例1及び実施例2と同一のSの値が得られることが確認できた。

#### 【0056】

なお、等化誤差の特性が明らかに白色であること、あるいは、白色に近いことが予め分かっている場合には、R0のみを算出する構成を取ることもできる。

#### 【0057】

（実施例4）

実施例1に記載した再生専用光ディスクを用いて、再生波形のサンプリング値の総数とSの関係を調べた。光ヘッド及び線速、PR等化などの測定条件は、サンプリングの総数を除いて、実施例1と同一の条件とした。なお、本実施例では、チルト0度の条件で測定を行った。サンプリングの総数を変化させながら、各サンプル数条件で複数回測定を行って得られたSの最小値（本実施例ではS1）を図7に示す。図7から、サンプル数が10000より少ないとSの値が大きくなつており、再生条件の調整が困難であることを示している。Sを指標として再生条件の調整を行うには、少なくとも10000以上のサンプル数が必要である。

**【0058】**

また実際のディスクフォーマットに合わせてSの値を計測する場合には、少なくとも一つのECCブロック単位で計測すれば都合がよい。例えば64KB単位のECCブロックの場合、786432ビットのサンプル数となり、Sの値の計測精度としては充分である。

**【0059】**

## (実施例5)

実施例2で記載した相変化光ディスクを用いて、再生波形のサンプル数とSの関係を調べた。光ヘッド及び線速、PR等化などの測定条件は、サンプリングの総数を除いて、実施例2と同一の条件とした。なお、本実施例では、フォーカスオフセットが0の条件で測定を行った。サンプリングの総数を変化させながら、各サンプル数条件で複数回測定を行ってSの値（この場合はSの中で最小である $S_3$ の値）を測定した結果、実施例5と同様に、サンプル数が10000より少ないとSの値が大きくばらつくことが確認された。従って、Sの値を指標として再生条件の調整を行うには、少なくとも10000以上のサンプル数が必要である。

**【0060】**

## (実施例6)

図8に記録データが既知のときに信号品質を評価するための機能ブロックの1例を示す。なお、図8には等化誤差を算出するための機能ブロック図のみ示してあるが、等化誤差算出後の演算に関しては、図2あるいは図6に示した構成に基づいて信号品質を評価すれば良い。記録再生装置で自ら記録したデータに対しSを測定する場合、記録データは予め分かっているので、ビタビ復号器出力の代わりに、既知の記録データを参照データとして用いてSを測定する。また、再生専用装置であっても、光ディスク上の所定の位置には常に同一のデータが記録されており、かつ、前記同一のデータが既知の場合には、再生専用装置の内部メモリーに前記同一のデータを記憶し、これを参照データとして用いてSを測定することも可能である。

**【0061】**

## (実施例7)

PR(1221)とd>=1の記録符号を用いる場合は、表4に上げたパタンについてSの値を評価すれば良い。また、より簡略にパタン1及びパタン2についてのみSの値を評価しても良い。

### 【0062】

【表4】

$\epsilon_i$  の組み合わせ例

パタン	$\epsilon_i$	$\sum \epsilon_i^2$
1	1 2 2 1	10
2	1 2 1 · 1 · 2 · 1	12
3	1 2 1 · 1 · 1 1 2 1	14

### 【0063】

なお、(1-7)変調とPR(12221)の組み合わせの実施例を中心に記述したが、他のPR方式と他の変調符号の組み合わせであっても、本発明により定式化されたSの値を算出することにより、ジッタ測定が困難な記録密度であっても、信号品質の評価、記録再生条件の調整を行うことが可能である。

### 【0064】

#### (その他の実施形態1)

誤りやすいデータ列を判別せずに毎クロック時刻毎の等化誤差に基づいて信号品質評価を行う実施例について記述してきたが、誤りやすい所定のデータ列を判別して、そのデータ列に対する等化誤差を用いて光ディスクの信号品質を評価することも可能である。この場合図2あるいは図6に記述した信号品質評価器中に図10に示したような判別器を設け、誤りやすいデータパタンに対してのみ等化誤差を取り込んで評価するようにすれば良い。図10における判別器は、判別器で予め設定されたパタンについてのみ等化誤差をその後の処理ブロックに出力する役割を持っている。

### 【0065】

#### (その他の実施の形態2)

信号品質評価器が算出したSの値に基づいて記録条件または再生条件のいずれか一方または両方を調整する機能を有する記録／再生条件調節器を備えた光学情報記録／再生装置の例を図9に示す。

### 【0066】

記録／再生条件調節器が、例えばチルトやフォーカスあるいは記録パワなどの記録／再生条件を調整すると、光ヘッドが、記録／再生条件調節器により調整された記録／再生条件に基づいた信号を読み出し、信号品質評価器が、光ヘッドにより読み出された信号の信号品質評価値Sを算出する。そして、記録／再生条件調節器は、算出された信号品質評価値Sを受け取る。

### 【0067】

更に、記録／再生条件調節器は、記録／再生条件を変化させながら、Sが最大となる、もしくは、Sが一定の値（例えば上記したように12以上）となるような最適な、または、ある一定以上の好適な記録／再生条件を見つける。そして、光ヘッドは、記録／再生条件調節器により設定された最適な、または、好適な記録／再生条件に基づいて光ディスクの記録／再生を行なう。このため、記録／再生条件調節器が信号品質評価器により算出された信号品質評価値Sを指標として最適な、または、好適な記録条件または再生条件を設定するため、光学情報記録／再生装置は、情報の記録／再生を安定した条件で行うことができる。

### 【0068】

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明を用いることにより、ジッタでは信号品質が評価できないような高記録密度条件下で、光学的情報記録媒体に記録された信号の品質を評価することが可能となる。また、本発明で規定した信号品質を指標として、記録あるいは再生条件を最適化することが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

信号品質を測定するための機能ブロックの構成の1例を示す図である。

##### 【図2】

エラーベクトル上に射影された等化誤差の分散を計算するための回路の構成の1例を示す図である。

##### 【図3】

記録密度が変化した際の再生波形の変化を模式的に説明する図である。

**【図 4】**

SとbERの関係を示す図である。

**【図 5】**

SとbERの関係を示す図である。

**【図 6】**

Sを算出するための回路の別の構成の1例を示す図である。

**【図 7】**

サンプル数とSの関係を示す図である。

**【図 8】**

記録データが既知の時にSを算出するための機能ブロックの構成の1例を示す図である。

**【図 9】**

本発明の記録条件あるいは再生条件を調整する機能を有する光学情報記録再生装置を示す図である。

**【図 10】**

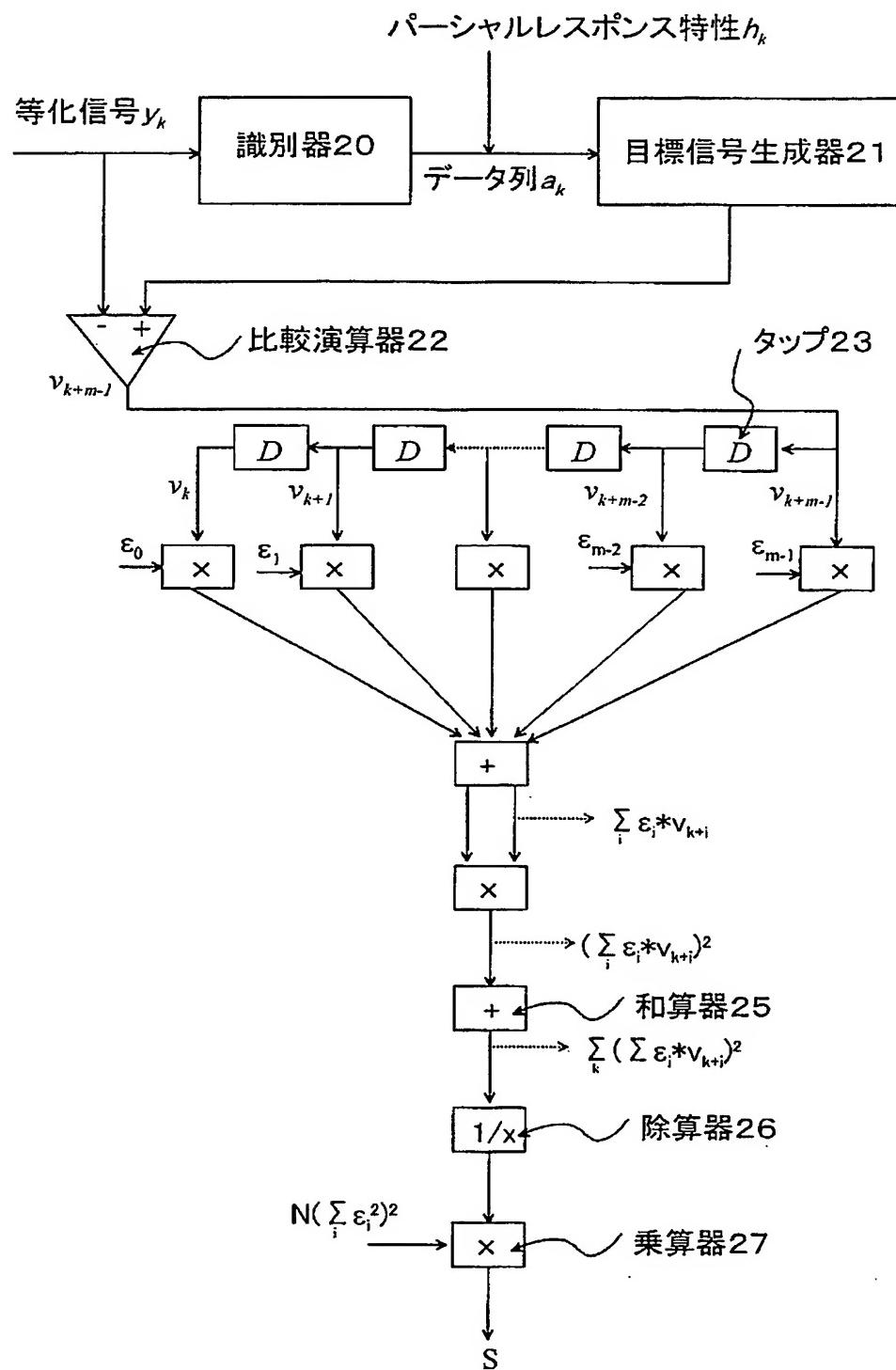
予め設定された目標信号のみでSを算出するための回路を示す図である。

【書類名】 図面

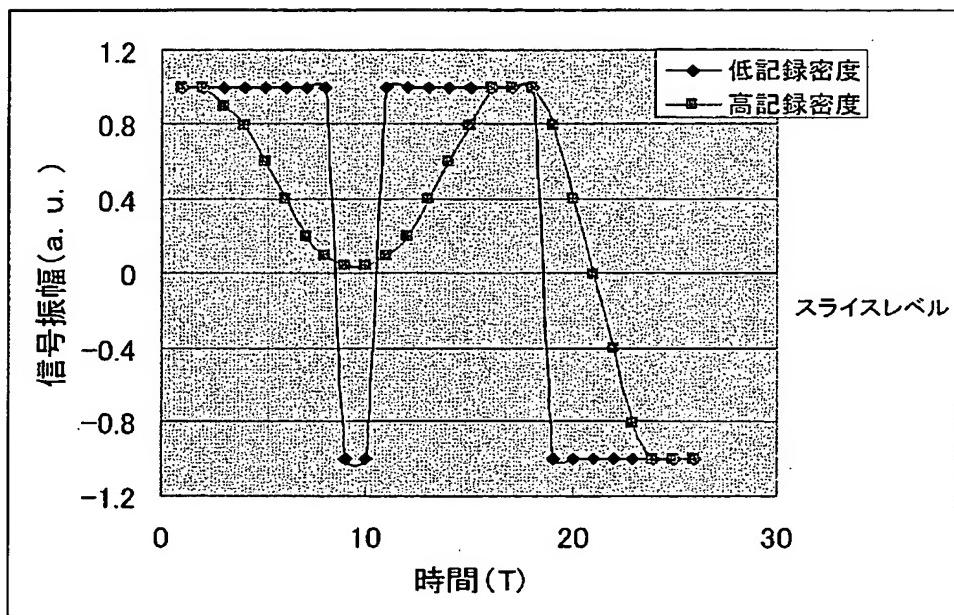
【図 1】



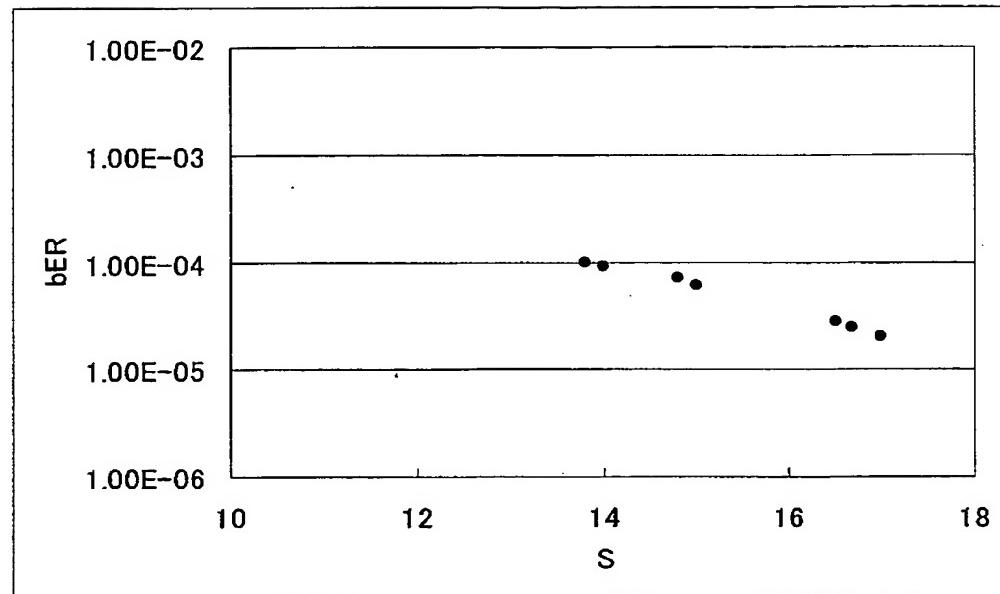
【図 2】



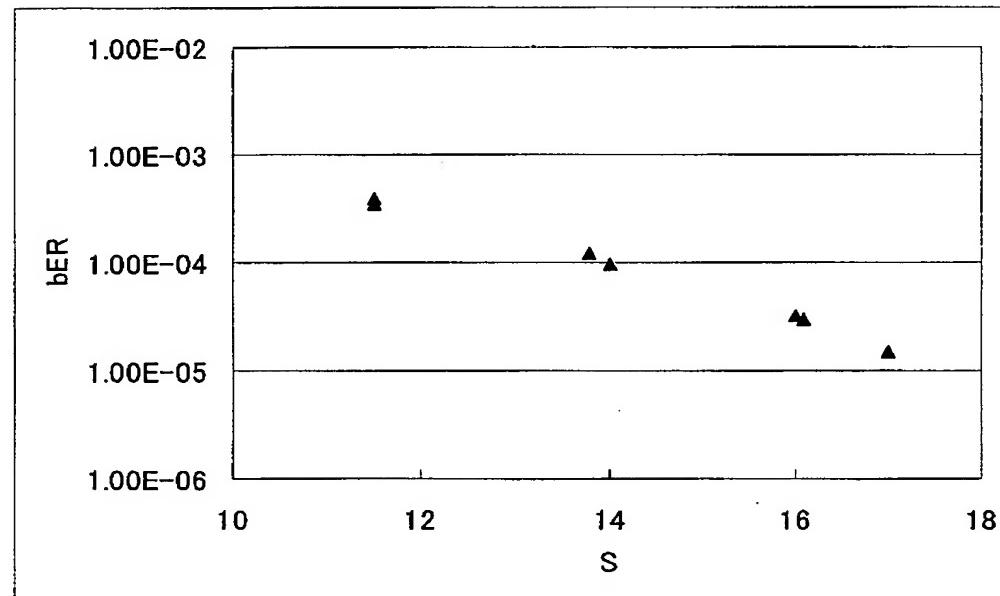
【図3】



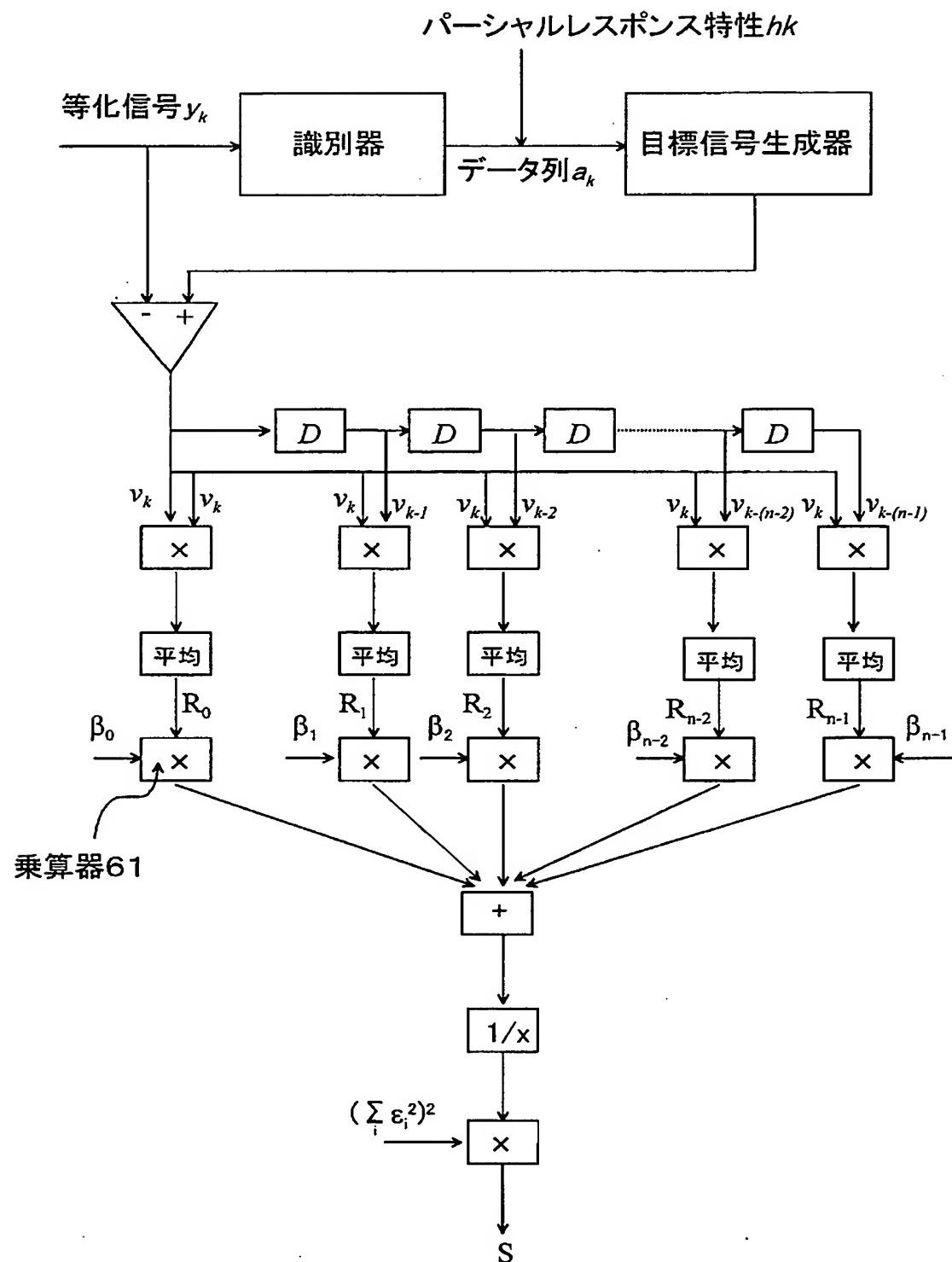
【図4】



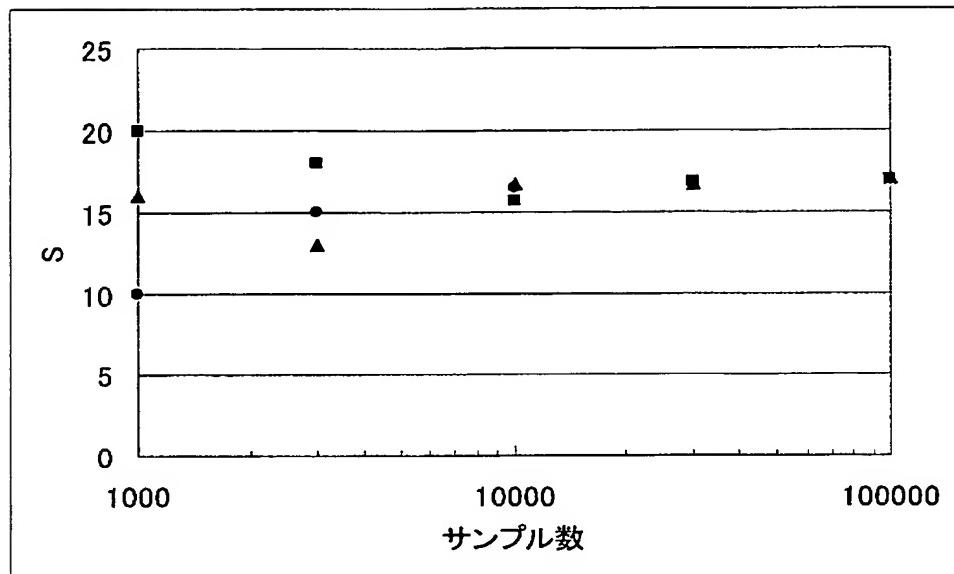
【図5】



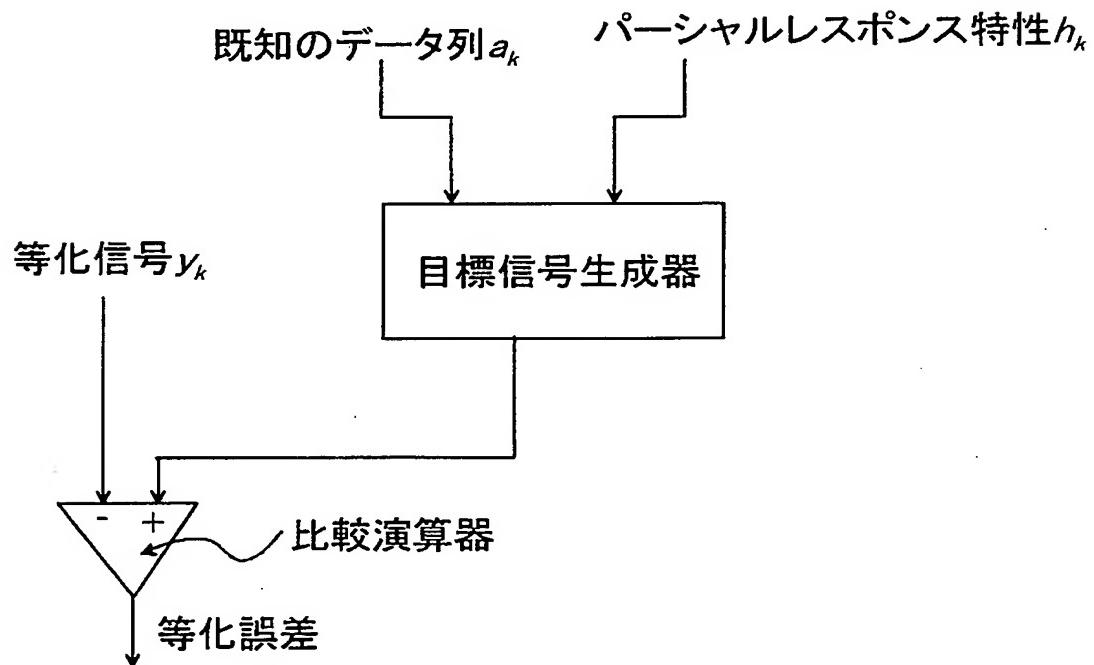
【図 6】



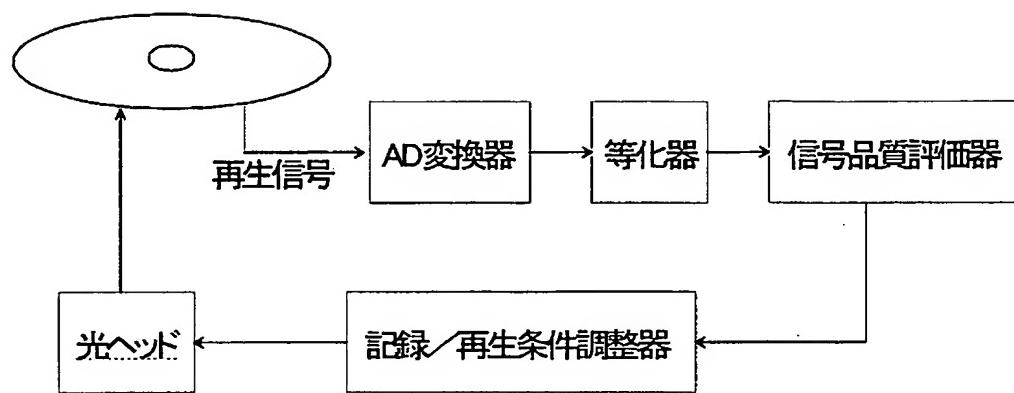
【図 7】



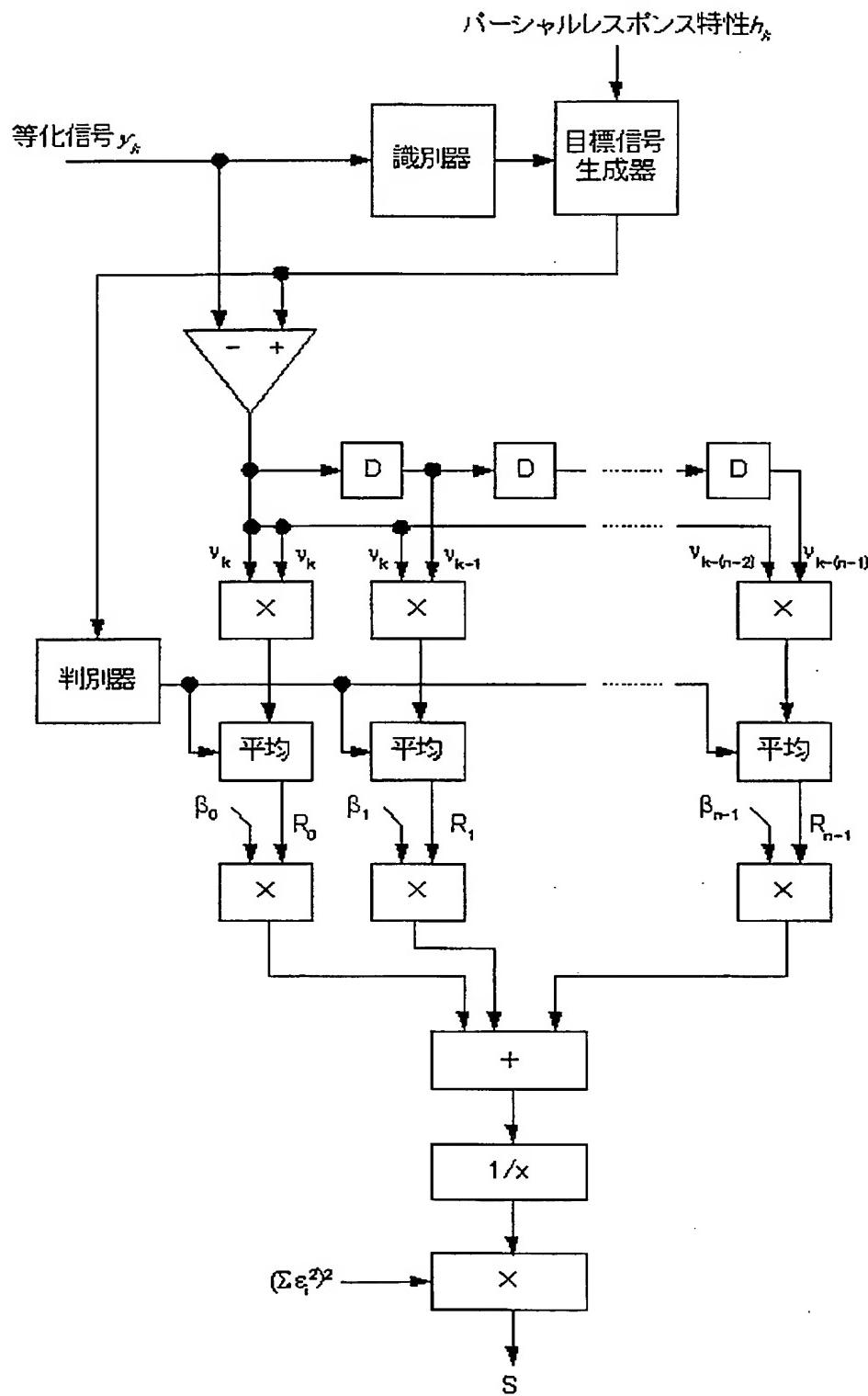
【図 8】



【図9】



【図 10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ジッタ測定が困難になるような高い記録密度を有する光ディスク媒体等に記録された信号の品質を評価する指標及びその基準値を与えると共に、これらを用いた信号品質の評価方法を提供する。

【解決手段】 光ディスク媒体等に記録された信号の品質を評価するために、所定のデータ列及び所定のパーシャルレスポンス特性から目標信号を求め、当該目標信号と、クロック周期毎の再生信号との差異である等化誤差をクロック周期毎に算出する。更に、算出された異なる時刻の等化誤差の積を求め、当該等価誤差の積に基づいて信号品質を評価する。

【選択図】 図 2

特願 2002-365772

出願人履歴情報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名 日本電気株式会社

特願 2002-365772

出願人履歴情報

識別番号 [000003078]

1. 変更年月日 2001年 7月 2日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区芝浦一丁目1番1号  
氏 名 株式会社東芝